

## OLED/QLED 发光器件寿命测试系统

OLED/QLED 发光器件寿命测试系统，具备性能稳定、操作简便、容易升级等优势，在国内外高校及企业获得广泛应用。

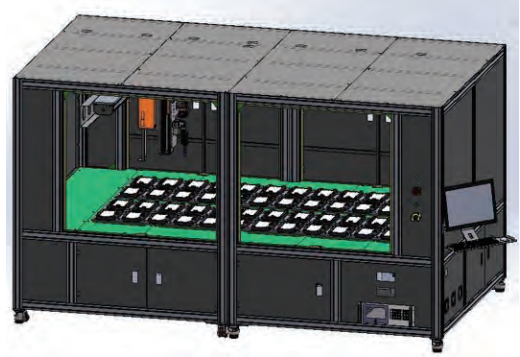


32 路系统

64 路系统

项目	关键指标	备注
通道数量	32、64、96、128	可扩展到 512 路
测量模式 1	恒流、恒压、恒亮度	需根据客户需求选定
测量模式 2	Pulse 电压、Pulse 电流	选配
电流输出	0.03uA~100mA，精度优于 ±1%	用户参照核心技术电流源选配
电压输出饱和亮度	1.0~20V，精度 <math>\leq \pm 1\%</math> 通常 10000cd/m <sup>2</sup> 以上	标配 可根据客户需求定制
器件结构	底发光、顶发光、倒装、正装	需根据用户需求定制
测试盒 / 夹具	测试晶片尺寸 $\leq 5\text{cm} \times 5\text{cm}$	可定制支持 20cm $\times$ 20cm
高温测试	RT+10 度 ~100 度；-50 度 ~100 度；环境测试	选配
特殊条件	特殊气氛测试；手套箱测试；UPS 电源等	选配、定制
软件平台	LabView	稳定、高效

## 模组寿命测试系统



平铺式模组寿命是通过亮度计来采集发光模组的亮度变化，从而计算 lifetime 的系统。

平铺式模组寿命通过把亮度计搭载在由 X、Y、Z 三个自动运动直线模组构成的运动平台上，实现在行程范围内任意点运动。在台面上依次放置由信号发生器（PG）点亮的模组，通过亮度计依次采集亮度变化，从而得到 lifetime 数据。

平铺式模组寿命可搭载亮度计直接量测发光膜组的真实数值，在研发和过程数据评判工作中，可起到重要作用。

抽屉式模组寿命是采用硅光电二极管代替亮度计采集模组发光亮度变化的一种新型测量方式。



**特点:** 通道数多，体积小，操作方便，各工位独立，成本较低，更安全。由信号发生器（PG）来点亮产品，通过集成硅光电二极管的采集系统感应产品的亮度变化，从而得出 lifetime 数据。